

60A、30V N沟道增强型场效应管

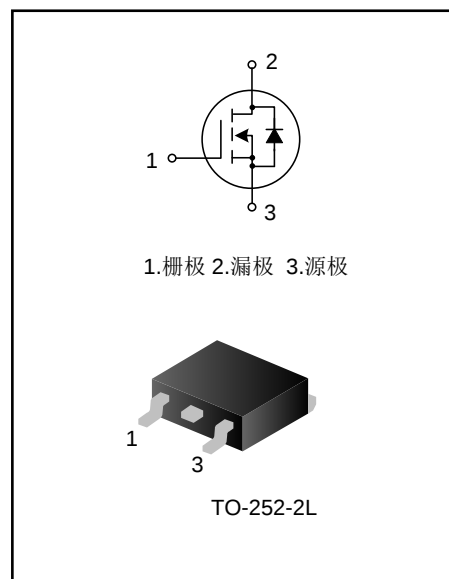
描述

SVT03100ND N 沟道增强型功率 MOS 场效应晶体管采用士兰的 LVMOS 工艺技术制造。先进的工艺及元胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

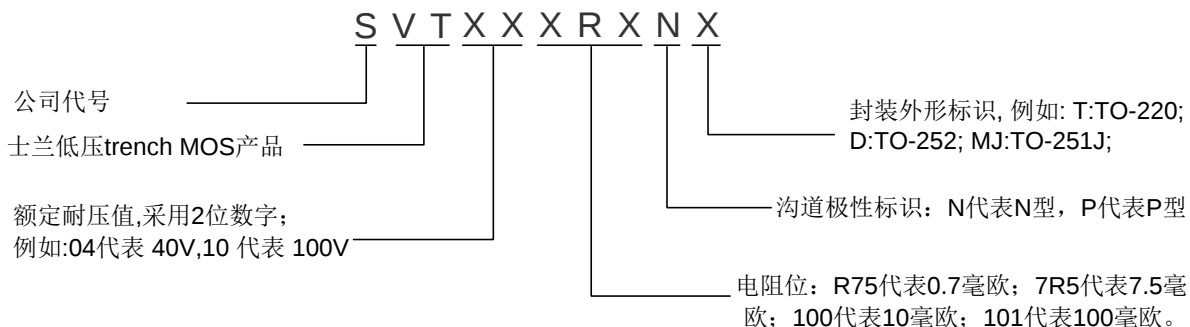
该产品可广泛应用于不间断电源及逆变器系统的电源管理领域。

特点

- ◆ 60A, 30V, $R_{DS(on)}$ (典型值) = $8.5m\Omega @ V_{GS}=10V$
- ◆ 低栅极电荷量
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力



产品命名规则



产品规格分类

产 品 名 称	封装形式	打印名称	环保等级	包 装
SVT03100NDTR	TO-252-2L	03100ND	无卤	编带

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称		符号	参数范围	单位
漏源电压		V_{DS}	30	V
栅源电压		V_{GS}	± 20	V
漏极电流	$T_c=25^{\circ}\text{C}$	I_D	60	A
	$T_c=100^{\circ}\text{C}$		38	
漏极脉冲电流		I_{DM}	240	A
耗散功率 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$) - 大于 25°C 每摄氏度减少		P_D	54	W
			0.4	W/ $^{\circ}\text{C}$
单脉冲雪崩能量 (注 1)		E_{AS}	85	mJ
工作结温范围		T_J	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围		T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参 数 名 称	符号	参数范围	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	2.3	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.0	$^{\circ}\text{C/W}$

关键特性参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	30	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	1.0	--	3.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=15A$	--	8.5	10	m Ω
栅极电阻	R_G	$f=1\text{MHz}$		5.2		Ω
输入电容	C_{iss}	$f=1\text{MHz}, V_{GS}=0V,$ $V_{DS}=30V$	--	1208	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	145	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	117	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=20V, V_{GS}=10V, R_G=6\Omega, I_D=15A$ (注 2,3)	--	4.7	--	ns
开启上升时间	t_r		--	34	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	40	--	
关断下降时间	t_f		--	16	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DD}=24V, V_{GS}=10V, I_D=15A$ (注 2,3)	--	26	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	5.0	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	5.5	--	

源-漏二极管特性参数

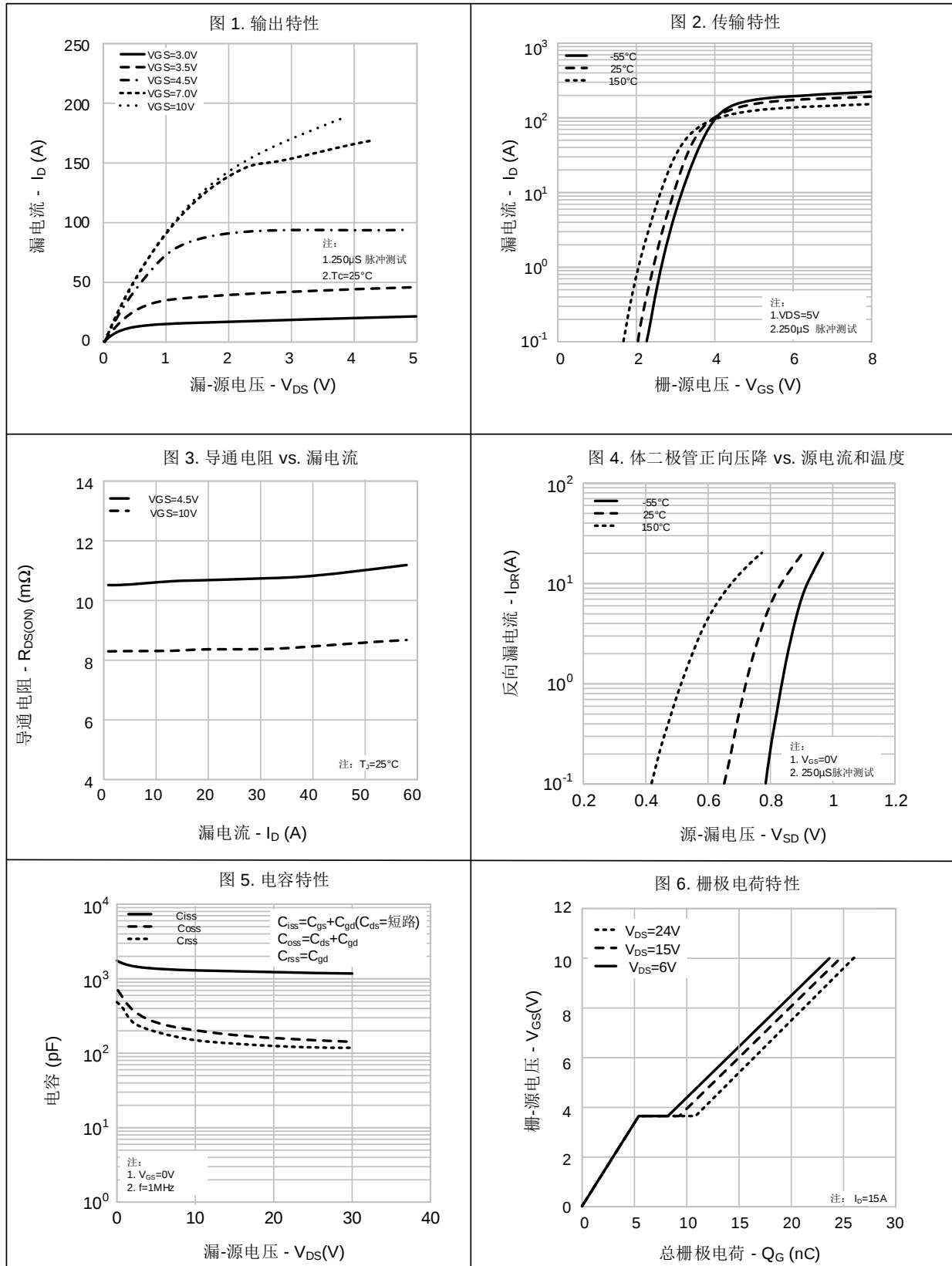
参 数	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	60	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	240	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=15A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=15A, V_{GS}=0V,$ $dI_F/dt=100A/\mu s$ (注 2)	--	13	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	0.005	--	μC

注:

1. $L=0.5mH$, $V_{DD}=15V$, $V_G=10V$, $R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。

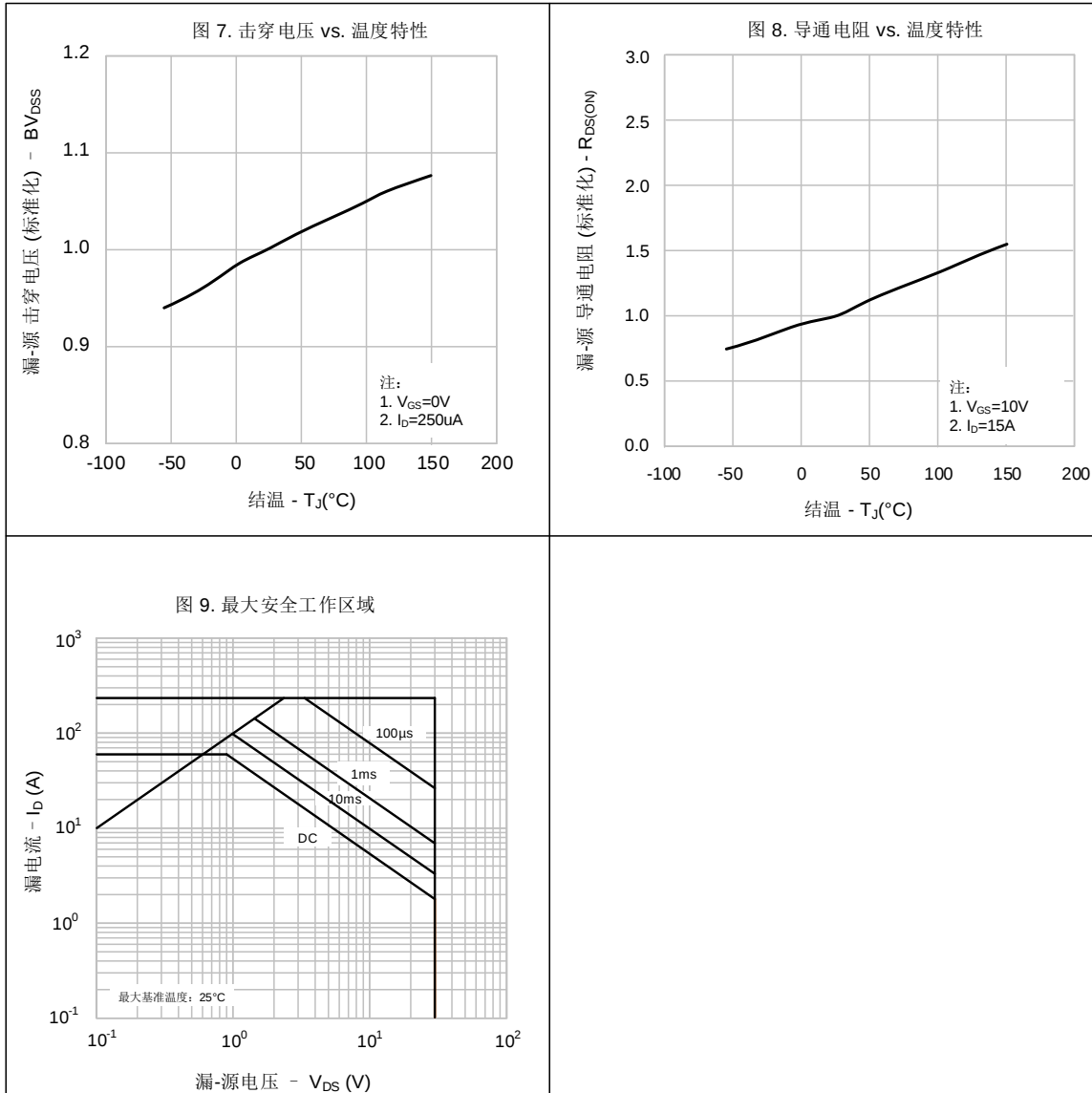


典型特性曲线



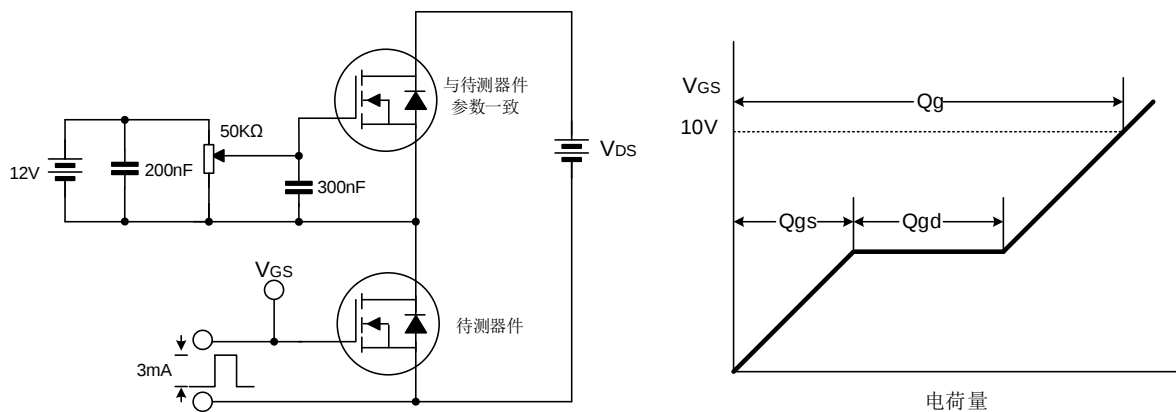


典型特性曲线(续)

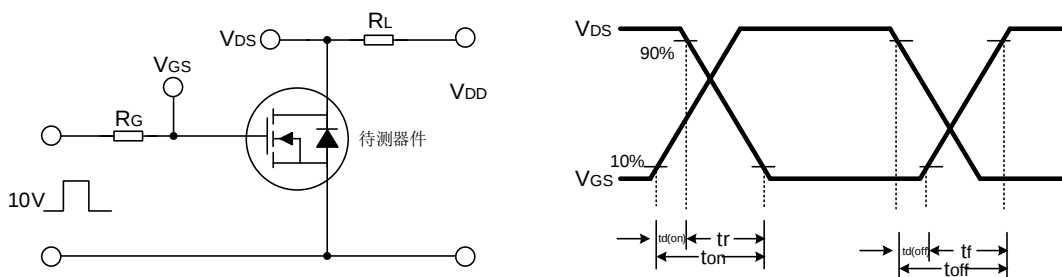


典型测试电路

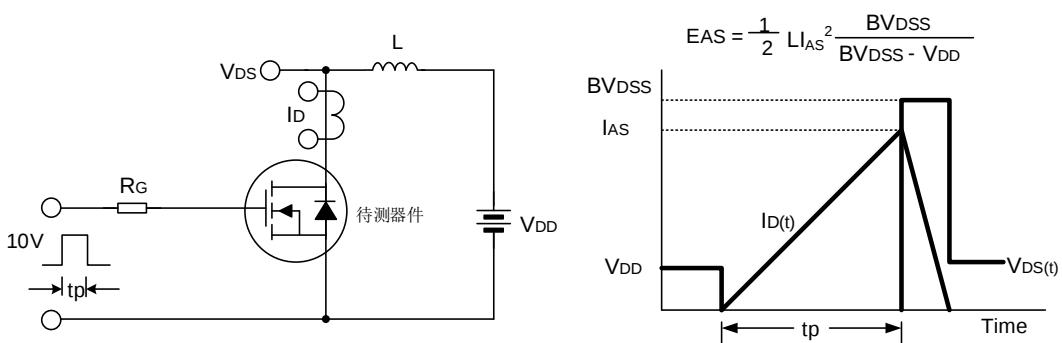
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



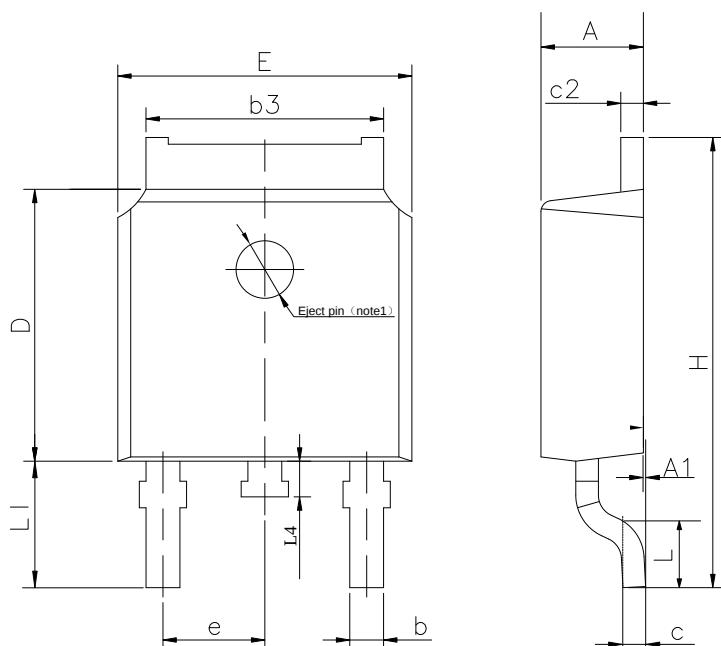
EAS测试电路及波形图



封装外形图

TO-252-2L

单位: 毫米



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	2.10	2.30	2.50
A1	0	---	0.127
b	0.66	0.76	0.89
b3	5.10	5.33	5.46
c	0.45	---	0.65
c2	0.45	---	0.65
D	5.80	6.10	6.40
E	6.30	6.60	6.90
e	2.30TYP		
H	9.60	10.10	10.60
L	1.40	1.50	1.70
L1	2.90REF		
L4	0.60	0.80	1.00

NOTE1 : There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.

声明:

- 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称:	SVT03100ND	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.1

修改记录:

1. 修改 Qrr 值为 0.05
 2. 修改图 5 Ciss 曲线
-

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布
-